## (新型)SDDによる β - FeOOHさび中極微量Tiの XAFS測定・評価

### -大口径半導体検出器の応用-

世木 隆<sup>1</sup>、中山 武典<sup>2</sup>、石川 達雄<sup>3</sup>、稲葉 雅之<sup>1</sup>、渡部 孝<sup>1</sup> <sup>1</sup>神戸製鋼所(コベルコ科研)、<sup>2</sup>神戸製鋼所 材料研究所、<sup>3</sup>大阪教育大





神戸製鋼所は、極微量Ti添加による $\beta$ -FeOOHを制御した新しい耐候業25% 候性鋼を開発している。

耐候性鋼の性能は、鋼表面に生成 する緻密なさび層の存在が重要で あると考えられている。しかし、さび は結晶と非結晶の双方の特徴を持っ ており、緻密なさび層形成に微量添 加元素がなぜ有効かの情報を得る ことは一般に難しい。

#### 狙い

図1 耐候性鋼の応用例

極微量Ti添加さびのTi、Feの局所構造を得る為に、XAFS測定を行う。 今まで極微量Ti添加 β-FeOOHのTi K 吸収端測定は困難だったが、 新型SDD(大口径半導体検出器)を用いて測定した。

図2 従来さびと開発中さびの

グレインサイズ比較

100nm

開発材錆層





	Ti K 端測定	Fe K 端測定
測定法	蛍光法	透過法
試料	一年熟成 β-FeOOH (Ti/Fe=0.1, 0.01)	一年熟成 β-FeOOH (Ti/Fe=0.1, 0.01,0)
2結晶分光	Si(111)	
集光·高調波除去	Rhコーティング シリンドリカルミラー	
4象限スリット径	1mm×1mm	
分光アンプ	ORTEC672	
Fine gain	1	
Caurse gain	200	
Shaping Time	1µs	



#### 新型SDD

### 本研究において、蛍光法によるTiK端測定は 新型SDD(SuperSDD)を用いて行われた。

#### SuperSDD

大面積高分解能半導体X線検出器 SuperSDD (株)X線技術研究所製

有効受光面積約50mm<sup>2</sup>

小型検出器による作業性向上



図1 新型SDDを用いたTi K 端測定 全景 BL16B2実験ハッチ内にて





図2 新型SDDを用いたTi K 端測定 Ti/Fe=0.01 β-FeOOHの測定の積算時間は13秒とした



Ti K 吸収端測定から得たXAFS





## **XANES**





## 振動関数





## Ti周リの動径分布関数





Fe K 吸収端測定から得たXAFS





## XANES







振動関数





Fe周りの動径分布関数



\*R = 0位置は、Fe原子位置に相当する。

# まとめ

1.新型SDDを用いる事によりTi添加 $\beta$  – FeOOH (Ti/Fe = 0.1, 0.01)の、Ti-K XAFS測定から、Ti/Fe添加量によるEXAFS 及びXANESスペクトルの変化を捉える事ができた。

測定の結果、Tiの局所構造について、特徴 が確認できた。これは、Ti原子とO原子の原子間距離に由来しているとすれば、イオン半径の変化が考えられる。そして、特徴 と は、FeとTiの局所構造において共に確認する事が出来た。

2.Ti/Fe=0.01  $\beta$ -FeOOHのTi K 吸収端から得たRDFを理解 する為に、FEFF8.2による計算値と実験値の比較を示す。 FEFF8.2の計算は、 $\beta$ -FeOOHの結晶学データをベース[1] とし、そのうちFe原子がTi原子一個で置換された場合を仮 定した。 $\beta$ -FeOOHの単位胞においてFeの等価位置は2箇 所ある為、各Feサイトを占有した場合それぞれについて計 算した(但し、FeとTiを置換する事により引き起こされる格子 緩和等は考慮していない)。

実験的に得られた特徴 は、遷移金属原子同士の存在 確率の変化を反映し、Ti/Fe=0.1から0.01へ減少すると共に、 さびネットワーク構造の秩序化が得られた事を示唆してい る。

3.遷移金属酸化物における共有結合は、主にFeあるいはTi 3d EO 2p の混成によってしばしば説明付けられる。仮に  $\beta$ -FeOOHにおいてFeがTiへ置換し、そしてFe<sup>3+</sup>( $d^5$ )が Ti<sup>4+</sup>( $d^0$ )へ置き換わるとすれば、共有結合に寄与する電子 数が減少する。その結果、Ti原子EO原子の間の結合が弱 められ、 $\beta$ -FeOOH結晶構造の長距離秩序に影響を与える 事が推測できる。



4.上記の電子状態に関する推論を高度化するために、電子状態を反映すると考えられるXANESスペクトル形状を 通じて、FEFF8.2, DV-Xαなどのシミュレーション解析を進める事を考えている。 また、電子状態に関する知見を深める為に、SR-XPS測定などを計画している。

[1] J. E.Post et al., American Mineralogist., 88, 782(2003)